

第 31 回表面技術セミナー

主催：岩手表面技術懇話会

共催：表面技術協会東北支部・電気化学会東北支部・化学工学会東北支部・日本表面科学会東北・北海道支部・日本化学会・いわて産業振興センター・一関工業高等専門学校・岩手大学研究推進機構

協賛：応用物理学会東北支部・腐食防食学会東北支部・電子情報通信学会東北支部

日時：平成 28 年 3 月 2 日（水） 13:30～17:00

会場：岩手大学工学部キャンパス内 復興祈念 銀河ホール

〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5

セミナー参加費：無料

定員：約 100 名

講演・講師（タイムテーブル）：

時間	題 目	内 容	講 師
13:30～13:40 開 会 挨拶			
13:40 14:30	一般 SPM が抱える問題を解決した最新 SPM 技術について	SPM/AFM（走査型プローブ顕微鏡/原子間力顕微鏡）には、現在も様々な技術的課題が存在する。ハードウェア・ソフトウェアの設計の根本的な見直しにより大きな進化を遂げた新技術を紹介する。	パーク・システム・ジャパン（株） 代表取締役 寺田 昇 氏
14:30～14:50 休 憩			
14:50 15:40	FE-SEM による材料解析の最前線：表面情報を捉える低加速高分解能観察と分析	近年 FE-SEM を用いた材料解析では、試料構造の微細化に伴い、分析・観察において、より表面に近い情報を如何に正確に捉えるかが課題となっている。今回は試料最表面観察とサブミクロン領域の分析を両立したショットキーFE-SEM「JSM-7800F PRIME」の新技術およびそれを用いた材料解析例を紹介する。	日本電子（株） SM 事業ユニット SM アプリ部 1T 山本 康昌 氏
15:40～16:00 休 憩			
16:00 16:50	ToF-SIMS の最新分析技術とその解析事例の紹介	飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）は、パルス状の一次イオンを固体試料に照射し、試料表面から放出される二次イオンが検出器に到達するまでの飛行時間差を利用して質量分析を行い、試料表面のキャラクタリゼーションを行う手法である。今回は TOF-SIMS の最新技術を用いた事例や情報を X 線光電子分光法（XPS）と比較しながら整理し、材料の表面処理などの構造評価などに代表される応用例を紹介する。	アルバック・ファイ（株） 星 孝弘 氏
16:50～ 閉 会 挨拶			

交流会：18:00～（盛岡市内、会費：5,000 円）（予定）

参加申込方法：「セミナー参加申し込み」および「交流会参加申し込み」に関して明記し、氏名、所属、住所、電話番号も忘れずに e-mail でお申し込みください。

申込先：岩手大学工学部応用化学・生命工学科 鈴木映一（幹事） e-mail：esuzuki@iwate-u.ac.jp